

CORRECCIÓN DE ERRORES

Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) 2020/1749 de la Comisión, de 7 de octubre de 2020, que modifica el Reglamento (CE) n.º 428/2009 del Consejo, por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje y el tránsito de productos de doble uso

(Diario Oficial de la Unión Europea L 421 de 14 de diciembre de 2020)

1. En la página 94, los puntos 2B206.c.1 y 2B206.c.2 se sustituyen por el texto siguiente:
 - «1. Que contengan un "láser", y
 2. Capaces de mantener durante 12 horas como mínimo, a una temperatura de ± 1 K (± 1 °C) en torno a una temperatura normalizada y una presión normalizada, todas las características siguientes:
 - a. Una "resolución", en toda la escala, igual a 0,1 μm o mejor, y
 - b. Con una "incertidumbre de medida" igual o mejor que (inferior a) $(0,2 + L/2\ 000)$ μm (donde L es la longitud medida expresada en mm).».
2. En la página 142, los puntos 3B001.f.3 y 3B001.g se sustituyen por el texto siguiente:
 - «3. Equipos diseñados especialmente para la fabricación de máscaras, que reúnan todas las características siguientes:
 - a. Un haz de electrones, un haz de iones o un haz "láser", enfocado y desviable, y
 - b. Que posean cualquiera de las características siguientes:
 1. Un tamaño de anchura de altura media (FWHM) del haz en el impacto (spot) inferior a 65 nm y una colocación de imagen inferior a 17 nm (media + 3 sigma), o
 2. Sin uso
 3. Un error de recubrimiento de la segunda capa inferior a 23 nm (media + 3 sigma) de la máscara
 4. Equipos diseñados para el proceso de dispositivos, utilizando métodos de escritura directa, que reúnan todas las características siguientes:
 - a. Un haz de electrones enfocado y desviable, y
 - b. Que posean cualquiera de las características siguientes:
 1. Un tamaño mínimo del haz inferior o igual a 15 nm, o
 2. Un error de recubrimiento inferior a 27 nm (media + 3 sigma)

g. Máscaras y retículas, diseñadas para circuitos integrados especificados en el artículo 3A001».
3. En la página 160, los puntos 5E001.d.1 a 5E001.d.8 se sustituyen por el texto siguiente:
 - «1. Tasados para operar a frecuencias superiores a 2,7 GHz e inferiores o iguales a 6,8 GHz, con un "ancho de banda fraccional" superior al 15 %, y que posean cualquiera de características siguientes:
 - a. Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 75 W (48,75 dBm) en cualquier frecuencia superior a 2,7 GHz e inferior o igual a 2,9 GHz, o
 - b. Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 55 W (47,4 dBm) en cualquier frecuencia superior a 2,9 GHz e inferior o igual a 3,2 GHz
 - c. Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 55 W (47,4 dBm) en cualquier frecuencia superior a 2,9 GHz e inferior o igual a 3,2 GHz, o
 - d. Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 20 W (43 dBm) en cualquier frecuencia superior a 3,7 GHz e inferior o igual a 6,8 GHz

2. Tasados para operar a frecuencias superiores a 6,8 GHz e inferiores o iguales a 16 GHz, con un "ancho de banda fraccional" superior al 10 %, y que posean cualquiera de las características siguientes:
 - a. Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 10 W (40 dBm) en cualquier frecuencia superior a 6,8 GHz e inferior o igual a 8,5 GHz, o
 - b. Una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 5 W (37 dBm) en cualquier frecuencia superior a 8,5 GHz e inferior o igual a 16 GHz
 3. Tasados para operar a una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 3 W (34,77 dBm) en cualquier frecuencia superior a 16 GHz e inferior o igual a 31,8 GHz y con un "ancho de banda fraccional" superior al 10 %
 4. Tasados para operar a una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 0,1 nW (- 70 dBm) en cualquier frecuencia superior a 31,8 GHz e inferior o igual a 37 GHz
 5. Tasados para operar a una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 1 W (30 dBm) en cualquier frecuencia superior a 37 GHz e inferior o igual a 43,5 GHz y con un "ancho de banda fraccional superior" al 10 %
 6. Tasados para operar a una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 31,62 mW (15 dBm) en cualquier frecuencia superior a 43,5 GHz e inferior o igual a 75 GHz y con un "ancho de banda fraccional" superior al 10 %
 7. Tasados para operar a una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 10 mW (10 dBm) en cualquier frecuencia superior a 75 GHz e inferior o igual a 90 GHz y con un "ancho de banda fraccional" superior al 5 %, o
 8. Tasados para operar a una potencia de pico de salida en estado de saturación superior a 0,1 nW (- 70 dBm) en cualquier frecuencia superior a 90 GHz».
4. En la página 175, los puntos 6A002.a.1.a a 6A002.a.1.d se sustituyen por el texto siguiente:
- «a. Detectores de estado sólido "calificados para uso espacial" que reúnan todas las características siguientes:
 1. Respuesta de pico en una gama de longitudes de onda superiores a 10 nm, pero que no sobrepasen los 300 nm, y
 2. Respuesta inferior a 0,1 % con respecto a la respuesta de pico a longitudes de onda superiores a 400 nm
 - b. Detectores de estado sólido "calificados para uso espacial" que reúnan todas las características siguientes:
 1. Respuesta de pico en una gama de longitudes de onda superiores a 900 nm, pero que no sobrepasen los 1 200 nm, y
 2. "Constante de tiempo" de respuesta igual o inferior a 95 ns
 - c. Detectores de estado sólido "calificados para uso espacial" que tengan una respuesta de pico en una gama de longitudes de onda superiores a 1 200 nm, pero que no sobrepasen los 30 000 nm
 - d. "Conjuntos de plano focal" "calificados para uso espacial" que tengan más de 2 048 elementos por conjunto y con respuesta de pico en una gama de longitudes de onda superiores a 300 nm, pero que no sobrepasen los 900 nm».

5. En la página 179, los puntos 6A002.b a 6A002.f se sustituyen por el texto siguiente:

«b. "Sensores monoespectrales de formación de imágenes" y "sensores multiespectrales de formación de imágenes" diseñados para aplicaciones de teledetección, y que presenten cualquiera de las características siguientes:

1. Campo de visión instantáneo (IFOV) inferior a 200 microrradianes, o
2. Especificados para funcionar en una gama de longitudes de onda superiores a 400 nm, pero que no sobrepasen los 30 000 nm, y que reúnan todas las características siguientes:
 - a. Que proporcionen salida de datos de imagen en formato digital, y
 - b. Que posean cualquiera de las características siguientes:
 1. "Calificados para uso espacial", o
 2. Estar diseñados para funcionamiento aerotransportado, utilizar detectores que no sean de silicio y tener un campo de visión instantáneo (IFOV) menor que 2,5 mrad (miliradianes)

Nota: El subartículo 6A002.b.1 no somete a control los "sensores monoespectrales de formación de imágenes", con respuesta de pico en una gama de longitudes de onda superiores a 300 nm, pero que no sobrepasen los 900 nm, y que incorporen únicamente alguno de los detectores no "calificados para uso espacial" o "conjuntos de plano focal" no "calificados para uso espacial" que se indican a continuación:

1. Dispositivos de carga acoplada (CCD) no diseñados ni modificados para alcanzar una 'multiplicación de carga', o
2. Dispositivos de semiconductores de óxido metálico complementarios (CMOS) no diseñados ni modificados para alcanzar una 'multiplicación de carga'.

c. Equipos de formación de imágenes de 'visión directa' que tengan alguno de los siguientes elementos:

1. Tubos intensificadores de imagen especificados en el subartículo 6A002.a.2.a o en el subartículo 6A002.a.2.b
2. "Conjuntos de plano focal" especificados en el subartículo 6A002.a.3, o
3. Detectores de estado sólido especificados en el subartículo 6A002.a.1

Nota técnica:

La expresión 'visión directa' se refiere a los equipos de formación de imágenes que presentan al observador humano una imagen visible sin convertirla en una señal electrónica para su visualización en una pantalla de televisión, y que no pueden grabar ni almacenar la imagen por medios fotográficos, electrónicos o de otra clase.

Nota: El subartículo 6A002.c no somete a control los equipos siguientes dotados de fotocátodos distintos de los de GaAs o GaInAs:

- a. Sistemas de alarma por allanamiento industriales o civiles, o sistemas de control o de recuento de tráfico o de movimientos en la industria
- b. Equipo médico
- c. Equipos industriales utilizados para la inspección, clasificación o análisis de las propiedades de los materiales
- d. Detectores de llama para hornos industriales
- e. Equipos diseñados especialmente para uso en laboratorio.

d. Componentes para uso especial, para sensores ópticos, según se indica:

1. Sistemas de refrigeración criogénicos "calificados para uso espacial"
2. Sistemas de refrigeración criogénicos no "calificados para uso espacial" con temperatura de la fuente de refrigeración inferior a 218 K (– 55 °C), según se indica:
 - a. De ciclo cerrado y con un tiempo medio hasta el fallo (MTTF) o un tiempo medio entre fallos (MTBF) superior a 2 500 horas
 - b. Minirefrigeradores autorregulables Joule Thomson (JT) que tengan diámetros interiores (exterior) inferiores a 8 mm
3. Fibras ópticas sensoras fabricadas especialmente, en su composición o estructura, o modificadas por revestimiento, de forma que sean sensibles a los efectos acústicos, térmicos, inerciales, electromagnéticos o a las radiaciones nucleares

Nota: El subartículo 6A002.d.3 no somete a control las fibras ópticas sensoras encapsuladas diseñadas especialmente para aplicaciones de detección de orificios de perforación.

- e. Sin uso
- f. 'Circuitos integrados de lectura' ('ROIC') diseñados especialmente para los "conjuntos de plano focal" especificados en el subartículo 6A002.a.3.

Nota: El subartículo 6A002.f no somete a control los 'circuitos integrados de lectura' diseñados especialmente para aplicaciones automovilísticas civiles

Nota técnica:

Un 'circuito integrado de lectura' ('ROIC') es un circuito integrado diseñado para subyacer o estar unido a un "conjunto de plano focal" ("FPA") y utilizado para leer (es decir, extraer y registrar) las señales producidas por los elementos detectores. Como mínimo, el 'ROIC' lee la carga de los elementos detectores extrayendo la carga y aplicando una función de multiplexado de manera que conserve la información de posicionamiento y orientación espacial relativa de los elementos detectores para tratamiento dentro o fuera del 'ROIC'.».
